

СОДЕРЖАНИЕ

Том 42, номер 2, 2013

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ФОТОПРИЕМНИКОВ

Перспективы применения твердых растворов $Pb_{1-x}Sn_xTe:In$ с $X > 0.3$ для фотоприемников с расширенным спектральным диапазоном чувствительности

*А. Н. Акимов, Д. В. Ищенко, А. Э. Климов, И. Г. Неизвестный, Н. С. Пашин,
В. Н. Шерстякова, В. Н. Шумский* 83

Влияние материала инжектирующих контактов на ВАХ пленок $Pb_{1-x}Sn_xTe:In$

*А. Н. Акимов, Д. В. Ищенко, А. Э. Климов, И. Г. Неизвестный, Н. С. Пашин,
В. Н. Шерстякова, В. Н. Шумский* 88

МИКРО- И НАНОСТРУКТУРЫ

Исследование электрических характеристик элементов памяти на самоформирующихся проводящих наноструктурах в виде открытой “сэндвич”-структуры $TiN-SiO_2-W$

В. М. Мордвинцев, С. Е. Кудрявцев 93

Однородное осаждение никеля в поры упорядоченного тонкого оксида алюминия

А. И. Воробьева, Е. А. Уткина, О. М. Комар 105

ЛИТОГРАФИЯ

Комплексные исследования эффектов зарядки полимерного резиста (ПММА) при электронной литографии

Э. И. Рау, Е. Н. Евстафьева, С. И. Зайцев, М. А. Князев, А. А. Свинцов, А. А. Татаринцев 116

МЕТРОЛОГИЯ

Измерение геометрических параметров наноразмерных объектов в низковольтном режиме растрового электронного микроскопа методом дефокусировки электронного пучка

*Д. С. Бодунов, М. А. Данилова, В. А. Кальнов, А. Ю. Кузин, В. Б. Митюхляев,
А. А. Орликовский, А. В. Раков, П. А. Тодуа, М. Н. Филиппов* 127

Измерение толщины естественного окисла на тестовой рельефной шаговой структуре на подложке из монокристаллического кремния

*В. П. Гавриленко, А. А. Кузин, А. Ю. Кузин, А. А. Кузьмин, В. Б. Митюхляев,
А. В. Раков, П. А. Тодуа, М. Н. Филиппов* 131

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРИБОРОВ В НАНОЭЛЕКТРОНИКЕ

Модель металлического квантового нанотранзистора с затвором на кулоновской блокаде в “магических” нанокристаллах Au_{55} и Ag_{55} с быстродействием 10^{11} Гц

В. А. Жуков, В. Г. Маслов 134

СХЕМОТЕХНИКА

Схемотехническое решение одноразрядного двоичного КМОП сумматора

Д. В. Морозов, М. М. Пилипко 146

Многоканальная микросхема для трековой системы эксперимента СВМ

Э. В. Аткин, А. Г. Воронин, А. Д. Клюев, И. А. Кудряшов, В. В. Шумихин 153